

小人数技術研修

「X線反射率による薄膜・多層膜の解析」

Microsoft Teams による小人数インターネット研修

<https://sakuraixlab.com/ReflectivityOnline.pdf>

X線反射率法は、薄膜・多層膜の深さ方向の内部構造、具体的には、各層の膜厚、密度、各界面のラフネス等を非破壊的に解析できる解析技術です。小人数にてインターネット研修を行っています。全く経験のない方でも、知識、技術を習得できるよう、懇切丁寧に解説いたします。X線反射率法による解析では30年以上の経験を有し「新版X線反射率法入門」(講談社2018年刊)の編著者でもある講師が、講義・演習・質疑応答を担当します。3回の小人数講義と1回のマン・ツー・マンセッションを別々の日に実施します。さらに終了後全日程終了後も、1週間以内であれば、無料でフォローアップ個別指導を受けられます。入門編Ⅰをご受講済みでさらに深く学びたい方には入門編Ⅱ、入門編Ⅲ、中級編を用意しております。関心のある方はお問い合わせください。

カリキュラム

- | | |
|---|-----|
| 第1コマ X線反射率の実験方法 | 60分 |
| X線反射率法の原理、装置、データ取得方法や注意事項を解説します。 | |
| 第2コマ X線反射率のシミュレーション | 60分 |
| シミュレーションの重要性およびご提供ソフトウェアの使用法を解説します。 | |
| 第3コマ X線反射率データの解析 | 60分 |
| データ解析に関する注意事項、よくある誤解について解説します。 | |
| 第4コマ マン・ツー・マンセッション | 20分 |
| ご相談やご質問などにお答えします。秘密保持契約の締結が必要な内容にもご相談に応じます。 | |

演習問題や、データ、ソフトウェアなど講義資料を事前配布します。
年4回開催、日時は受講者の皆様のご都合にあわせ調整します。

講師紹介 桜井健次 (さくらいけんじ)

東京大学大学院修了、工学博士。イメージング物理研究所 所長。元 (国) 物質・材料研究機構 上席研究員(32年間勤務、定年退職)、元 筑波大学大学院教授(「X線物理学入門」を16年間講義、現在は筑波大学数理物質系名誉連携教授)。「X線反射率による薄膜・多層膜の解析」講習会を2007年～2020年、9回にわたって主催。編著書として「新版X線反射率法入門」(講談社2018年)、「リファレンスフリー蛍光X線分析入門」(講談社2019年)。



申し込み方法 下記Webページにて、お申し込みください。

折り返し、詳細なご連絡をいたします。事前のご相談、お問い合わせも歓迎いたします。

<http://xray-neutron-buried-interface.jp/OnlineLectureApplication.html>

連絡先 イメージング物理研究所 桜井健次研究室
(埋もれた界面のX線・中性子解析研究会 事務局)
TEL 090-1432-2171
e-mail inquiry@sakuraixlab.com